

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 26 年 2 月 27 日 (2014.2.27)

【公表番号】特表 2009-536717 (P2009-536717A)
 【公表日】平成 21 年 10 月 15 日 (2009.10.15)
 【年通号数】公開・登録公報 2009-041
 【出願番号】特願 2008-552372 (P2008-552372)
 【国際特許分類】

G 0 1 N 23/04 (2006.01)

A 6 1 B 6/00 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 23/04

A 6 1 B 6/00 3 3 0 Z

【誤訳訂正書】
 【提出日】平成 25 年 12 月 26 日 (2013.12.26)
 【誤訳訂正 1】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 5 0
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 5 0】

対象物の画像を検知する他の例において、第一の角度位置に置かれたアナライザー結晶 A C から放射される第一の回折ビームから、第一の角度の対象物 O の画像を検知することができる。対象物 O の第一の角度の画像を、アナライザー結晶 A C の低ロッキングカーブ角度で検知することができる。更に、第二の角度位置に置かれたアナライザー結晶 A C から放射される第二の回折ビームから、第二の角度の対象物 O の画像を検知することができる。対象物 O の第二の角度の画像を、アナライザー結晶 A C の高ロッキングカーブ角度で検知することができる。これら第一と第二の画像をコンピューター C で結合して一つの屈折画像を導き出すことができる。更に、コンピューター C は、この屈折画像から、対象物 O の重量密度画像を導き出すことができる。重量密度画像は、コンピューター C のディスプレイを介して使用者に表示されることができる。

図 5 は、本発明の一つの実施形態の図 1 A ~ 1 E 及び 3 に示された D E I システム 1 0 のアナライザー結晶 A C の側面図を示す。図 5 は、固有放射線 K₁ と K₂ がアナライザー結晶 A C の表面で回折する様子を示す。一つ以上の X 線エネルギーを調節することは改善された X 線フラックスをもたらすことができる。

【誤訳訂正 2】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 5 5
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 5 5】

ブロック 7 1 0 において、アナライザー結晶 A C から回折したビームにより、対象物 O の画像を検知することができる。例えば、検知器 D D はアナライザー結晶 A C から回折したビームを検知することができる。この回折したビームは、以下の典型的な検知器のいずれかで検知できる：検知した画像をデジタル化するように構成された検知器；X 線フィルム；及び画像プレート。一例として、アナライザー結晶のロッキングカーブのピーク及び/又はその近傍で、アナライザー結晶から回折したビームにより、対象物の画像を検知することができる。

この例においては、これらのピークはロックングカーブのダーウィン幅の約半分以内にあることができる。検知された画像は処理されて、コンピューターCを介して使用者に表示されることができる。

対象物の画像を検知する他の例において、第一の角度位置に置かれたアナライザー結晶ACから放射される第一の回折ビームから、第一の角度の対象物Oの画像を検知することができる。対象物Oの第一の角度の画像を、アナライザー結晶ACの低ロックングカーブ角度で検知することができる。更に、第二の角度位置に置かれたアナライザー結晶ACから放射される第二の回折ビームから、第二の角度の対象物Oの画像を検知することができる。対象物Oの第二の角度の画像を、アナライザー結晶ACの高ロックングカーブ角度で検知することができる。これら第一と第二の画像をコンピューターCで結合して一つの屈折画像を導き出すことができる。更に、コンピューターCは、この屈折画像から、対象物Oの重量密度画像を導き出すことができる。重量密度画像は、コンピューターCのディスプレイを介して使用者に表示されることができる。